

ANWENDERKONFERENZ OPTISCHE MIKROSYSTEME

VERANSTALTUNGSPROFIL

Was? Anwenderkonferenz mit Vorträgen, Poster- und Exponateausstellung

Für wen? Entscheidungsträger aus Industrie und Wissenschaft, Fachpublikum

Parken 1. Tag: Parkplatz CiS Forschungsinstitut
2. Tag: „Parkhaus Am Stadion“ Johann-Sebastian-Bach-Straße, 99096 Erfurt

Übernachtung: ibis Hotel Erfurt Altstadt
Mercure Hotel Erfurt Altstadt

Organisation: Andreas Albrecht
Tel.: 0361 / 66 31 475
a.albrecht@amos-solution.de

Anmeldung: unter www.amos-solution.de

Gefördert durch:



VDI|VDE|IT

Partner:



FREISTAAT THÜRINGEN
Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Technologie



Veranstaltungsorte:

- 1 CiS Forschungsinstitut, Konrad-Zuse-Str. 14, 99099 Erfurt
- 2 IHK Erfurt, Arnstädter Str. 34, 99096 Erfurt

Veranstalter:

amos - applikationszentrum mikrooptische systeme
im CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik und
Photovoltaik GmbH

www.amos-solution.de



Anwenderkonferenz

Optische Mikrosysteme

Mehr Funktionen, geringere Kosten und höhere Qualität – Referenten aus Industrie und Forschung stellen sich diesen Herausforderungen und zeigen Beispiele für die Nutzung miniaturisierter Sensorik und Optik sowie die Integration von hochleistungsfähigen Komponenten in optoelektronischen Mikrosystemen.

**ANWENDERKONFERENZ
OPTISCHE MIKROSYSTEME**

20. - 21. November 2012



ANWENDERKONFERENZ OPTISCHE MIKROSYSTEME

Dienstag, 20. November 2012

CiS Forschungsinstitut, Konrad-Zuse-Str. 14, 99099 Erfurt

14:45	Führung durch das CiS Forschungsinstitut
16:00	Begrüßung und Moderation, <i>Hans-Martin Bitzer, OptoNet e.V.</i>
16:10	Grußworte <i>Jochen Staschewski, Staatssekretär, Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie</i> <i>Dr. Arnulf Wulff, LEG Thüringen mbH</i>
16:30	Assistenzsysteme in der Medizin - Quo vadis? <i>Dr. Ralf von Baer</i> <i>Geschäftsführer</i> <i>Robert Bosch Healthcare GmbH</i>
17:00	<i>Das Potential der MST in der Messtechnik für Labor und Prozess</i> <i>Dr. Reinhard Baumfalk</i> <i>Vice President R&D</i> <i>Sartorius Weighing Technology GmbH</i>
17:30	Applikationszentrum amos: Entwicklung und Strategie <i>Dr. Olaf Brodersen, CiS Forschungsinstitut</i>
17:45	Unterzeichnung amos - Kooperationsvertrag <i>Dr. Hans-Joachim Freitag, CiS Forschungsinstitut</i> <i>Prof. Dr. Andreas Tünnermann, Fraunhofer IOF</i>
18:00	Get together
20:00	Kulturprogramm Geführte Nachtwanderung durch Erfurt

Mittwoch, 21. November 2012

IHK Erfurt, Arnstädter Str. 34, 99096 Erfurt

09:00	Begrüßung <i>Detlef Reuter, IHK Erfurt</i> Eröffnung der Fachkonferenz <i>Dr. Klaus Schindler, OptoNet e.V.</i> Vorstellung Applikationszentrum amos <i>Andreas Albrecht, CiS Forschungsinstitut</i>
Gesundheit / Life Science	
	Moderation <i>Bernd Schöller, MCC Ges. f. Diagnosesysteme in Medizin und Technik mbH & Co. KG</i>
09:20	EKG-gekoppelter Pulswellenanalysator für das Screening vaskulärer Dysregulation in der normotensiven Glaukomdiagnostik <i>Kristin Feld, Aviant GmbH</i> <i>Uwe Buschmann, CiS Forschungsinstitut</i>
09:40	Optischer Lageindikator - ein Schlüsselement in der hochauflösenden Wägetechnik <i>Michael Müller, Sartorius Weighing Technology GmbH</i> <i>Dennis Mitrenga, CiS Forschungsinstitut</i>
10:00	Kontinuierliches klinisches Blutzucker-Monitoring mit Polarisationssensoren <i>Kai Zirk, SES - Entwicklung GmbH</i> <i>Dr. Hans-Joachim Freitag, CiS Forschungsinstitut</i>
10:20	Kaffeepause Poster- und Exponateschau

Aufbau- und Verbindungstechnik

	Moderation <i>Wolfgang Brode, SIEGERT TFT GmbH</i>
11:00	UP-Bearbeitung mikrooptischer Arraystrukturen für Faserkoppler <i>Dr. Erik Beckert, Fraunhofer IOF</i>
11:20	Skalierbare Faserschmelzkoppler <i>Christa Peters, CeramOptec GmbH</i> <i>Steffen Böhme, Fraunhofer IOF</i>
11:40	Solder Jet Bumping - Basistechnologie für die Mikromontage elektronenoptischer Baugruppen <i>Hans-Joachim Döring, Vistec Electron Beam GmbH</i>
12:00	Mittagspause Poster- und Exponateschau

Messtechnik

	Moderation <i>Dr. Reinhard Baumfalk, Sartorius Weighing Technology GmbH</i>
13:30	Einsatz von Diodenarrays im Bereich der Fahrdynamik <i>Lukas Püllen, Kistler Automotive GmbH</i> <i>Dr. Olaf Brodersen, CiS Forschungsinstitut</i>
13:50	Chemolumineszenzdetektoren für NO ₂ <i>Dr. Olaf Kiesewetter, UST Umweltsensorik GmbH</i> <i>Andreas Schmidt, CiS Forschungsinstitut</i>

14:10	Mikromechatronisches Interferometer für mechanische und geometrische Messgrößen <i>Olaf Mollenhauer, TETRA Ges. f. Sensorik, Robotik und Automation mbH</i> <i>Dr. Martin Schädel, CiS Forschungsinstitut</i>
14:30	Kaffeepause Poster- und Exponateschau

Industriesensorik und Prozessautomation

	Moderation <i>Michael Philipps, Endress+Hauser Consult AG</i>
15:10	Daten- und Leistungsübertragung mit Lichtwellenleiter für die Sensorik <i>Erhard Thiel, Ratioplast-Optoelectronics GmbH</i> <i>Reinhard Jurisch, microsensys GmbH</i>
15:30	Entwicklung und Einsatz eines Schneidkantensensors <i>Dr. Werner Fuchs, Mahr GmbH</i> <i>Dr. Peter Kühmstedt, Fraunhofer IOF</i>

Kompetenzdreieck Optische Mikrosysteme

	Moderation <i>Volker Wiechmann, medways e.V.</i>
15:50	Optische Pinzette <i>Prof. Sinzinger, TU Ilmenau</i>
16:10	3D-Integration in der Mikrosystemtechnik <i>Uwe Schwarz, X-FAB Semiconductor Foundries AG</i>
16:30	Schlussworte <i>Dr. Klaus Schindler, OptoNet e.V.</i>